



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100712001

2010 年 7 月 22 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

PWR (パワーマネジメント) プラグインパワー 一部製品 吸湿レベル (MSL) 変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	PWR プラグインパワー 一部製品 吸湿レベル (MSL) 変更 現行：吸湿レベル (MSL) L-1/235C 変更後：吸湿レベル (DUAL MSL) L-1/235C, L-3/260C, 防湿梱包	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	7 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

弊社 PWR (パワーマネジメント) プラグインパワー 一部製品について、現行 吸湿レベル (MSL) LEVEL-1/235Cを適用していますが、DUAL MSLによる260Cリフロー温度対応の為に、吸湿レベル (DUAL MSL) LEVEL-1/235C, LEVEL-3/260C に変更し認定しました。同時に防湿梱包に変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
吸湿レベル (MSL)	L-1/235C	L-1/235C, L-3/260C (DUAL MSL)
梱包形態	通常梱包	防湿梱包

理由：DUAL MSL による 260C リフロー温度対応の為

対象製品リスト

対象製品名				
PTD08A006WAD	PTD08A015WAD	PTH08T210WAD	PTH12050WAD	PTH12060WAD
PTD08A010WAD	PTD08A020WAD	PTH08T210WAH	PTH12050WAH	PTH12060WAH

製品表示

この変更に伴い、下図のように、梱包箱記載の吸湿レベル (MSL) が DUAL MSL に変更されます。



図1 出荷ラベル表記例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	-	終了	2007 年 7 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1		Device2	
Qual Device:	PTH08T240WAH		PTH08T240WAS	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
			Device1	Device2
Biased Life	Approx. 41,760 devices hours, 100.3C case temperature		40/0	-
Biased Humidity	Approx. 12,480 device hours, 85C/85% R.H.		40/0	-
Thermal Shock	-40C/125C, 200Cycles		40/0	-
Vibration	15g		9/0	9/0
Mechanical Shock	500g		3/0	-
	250g		-	3/0
Radiated Emissions	Class B EN55022 Regulations		Approved	-
Note: Preconditioning, IPC/JEDEC J-STD-033A				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	-	終了	2005 年 12 月 8 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:		Device1	Device2	
Qual Device:		PTH08T210WAH	PTH08T210WAS	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
			Device1	Device2
Biased Life	Approx. 41,200 devices hours, 90.8C case temperature		40/0	-
Biased Humidity	Approx. 10,560 device hours, 85C/85% R.H.		40/0	-
Thermal Shock	-40C/125C, 200Cycles		40/0	-
Vibration	15g		9/0	9/0
Mechanical Shock	250g		3/0	3/0
Note: Preconditioning, IPC/JEDEC J-STD-033A				